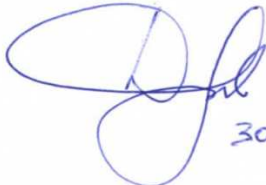


Ученому секретарю диссертационного совета Д.003.051.01  
ФБГУН Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН  
д.ф.-м.н. Надолинному В.А.

Я, Дроздов Юрий Николаевич, д.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ  
«Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской  
академии наук», согласен выступить официальным оппонентом по диссертационной работе  
СУХИХ Александра Сергеевича «РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СЛОЕВ НЕЗАМЕЩЕННЫХ И ЗАМЕЩЕННЫХ  
ФТАЛОЦИАНИНОВ МРс (M = Co, Pd, Zn, VO)», представленной на соискание ученой  
степени кандидата физико-математических наук по специальности 02.00.04 – физическая  
химия.

Личные данные:

1. Ученая степень - д.ф.-м.н. (дата присвоения 13 апреля 2007 года), шифр специальности 01.04.07 - физика конденсированного состояния и 01.04.01 - приборы и методы экспериментальной физики (дата защиты 19 октября 2006 года).
2. Список наиболее значимых публикаций в приложении 1.
3. Контактная информация - e-mail: [drozdyu@ipmras.ru](mailto:drozdyu@ipmras.ru), раб. тел. (831)4179491.

  
30.10.2018

Дроздов Ю.Н.

Подпись Дроздова Ю.Н. заверяю:  
Ученый секретарь ИФМ РАН,  
кандидат физико-математических наук




Д.М. Гапонова

Приложение 1

Выборочный список публикаций Ю.Н. Дроздова за последние 5 лет

1. Yunin P.A., Drozdov Y.N. How to distinguish between opposite faces of an a-plane sapphire wafer. Journal of Applied Crystallography. 2018, V. 51, part 2, P. 549.
2. Дроздов Ю.Н., Хрыкин О.И., Юнин П.А. Проверка гипотезы о термоупругом характере деформации слоя (0001)GaN, выращенного на а-срезах сапфира. Физика и техника полупроводников. 2018. Т. 52, вып. 11, с. 1380.
3. Юнин П.А., Дроздов Ю.Н., Хрыкин О.И., Григорьев В.А. Исследование анизотропии структурных свойств слоев (0001)GaN, выращенных методом МОГФЭ на а-срезах сапфира (1120). Физика и техника полупроводников. 2018. Т. 52, вып. 11, с. 1300.
4. Ю.Н. Дроздов, В.М. Данильцев, М.Н. Дроздов, П.А. Юнин, Е.В. Демидов, П.И. Фоломин, А.Б. Гриценко, С.А. Королев, Е.А. Суровегина. Исследование ограничений метода рентгеновской дифрактометрии при анализе вхождения атомов теллура в эпитаксиальные слои GaAs. Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2017, №3, с. 89.
5. Юнин П.А., Дроздов Ю.Н. Использование внешнего эталона в рентгенодифракционном анализе эпитаксиальных слоев. Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2016, №1, с. 68.
6. Юнин П.А., Дроздов Ю.Н. Использование псевдоморфного слоя на вицинальной подложке в качестве тестового образца для высокоразрешающей рентгеновской дифрактометрии. Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2015, №12, с. 40.



Дроздов Ю.Н.

30.10.2018

Подпись Дроздова Ю.Н.. заверяю:  
Ученый секретарь ИФМ РАН,  
кандидат физико-математических наук



Д.М. Гапонова